

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 9 月 15 日 (15.09.2005)

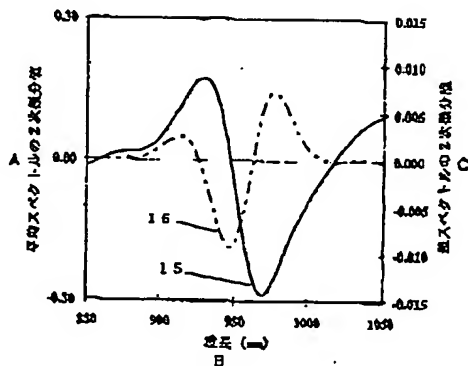
PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/085779 A1

- (51) 国際特許分類: G01J 3/02 (72) 発明者; および  
(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/003517 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 河野 澄夫 (KAWANO, Sumio) [JP/JP]; 〒3000816 茨城県土浦市永国東町 4 3-1 5 Ibaraki (JP). サランウオング シリンナパー (SARANWONG, Sirinnapa) [TH/JP]; 〒3050032 茨城県つくば市竹園 2 丁目 2 0 番地 4 竹園ハウス 6 0 4 号 Ibaraki (JP).  
(22) 国際出願日: 2005 年 3 月 2 日 (02.03.2005)  
(25) 国際出願の言語: 日本語  
(26) 国際公開の言語: 日本語  
(30) 優先権データ: 特願 2004-058443 2004 年 3 月 3 日 (03.03.2004) JP  
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 独立行政法人 食品総合研究所 (NATIONAL FOOD RESEARCH INSTITUTE) [JP/JP]; 〒3058642 茨城県つくば市観音台 2-1-1 2 Ibaraki (JP).  
(74) 代理人: 小山 有 (KOYAMA, Yuu); 〒1020083 東京都千代田区麹町 5 丁目 7 番地 秀和紀尾井町 T B R ビル 9 2 2 号 Tokyo (JP).  
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MG, MK, MN, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PK, PL, PT, RU, SA, SD, SE, SG, SI, SK, SL, SM, SN, SR, SS, ST, SV, SY, TD, TG, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VE, VG, VI, VN, YU, ZA, ZM, ZW.  
[続案有]

(54) Title: METHOD FOR LEVELING RESPONSE CHARACTERISTICS OF SPECTROSCOPE

(54) 発明の名称: 分光装置応答特性の平準化法



A SECOND DIFFERENTIATION VALUE OF AVERAGE SPECTRUM  
B WAVELENGTH (nm)  
C SECOND DIFFERENTIATION VALUE OF DIFFERENCE SPECTRUM

(57) Abstract: [PROBLEMS] A method for leveling the response characteristic of a spectroscope in which an error in the response characteristic of the spectroscope resulting from the differences in the response characteristic among a light source, a spectrometer, and a sensor is corrected. [MEANS FOR SOLVING PROBLEMS] The difference spectrum between a child unit and a parent unit is determined by subtracting the spectrum of a standard substance measured by the parent unit from the spectrum of the identical substance measured by the child unit, this difference spectrum is then subtracted from the spectrum of each individual sample measured by the child unit thus matching the response characteristic of the child unit to the response characteristic of the parent unit. In an apparatus to which a near infrared spectroscopy is applied and which comprises a light source, a spectrometer, and a sensor, the difference of absorbance at each wavelength between the child unit and the parent unit is generated similarly when an individual sample is measured, and accordingly the difference of absorbance at each wavelength is subtracted from the spectrum of the individual sample. Thus the spectral distortion resulting from an error in the response characteristic of the spectrometer can be corrected.

(57) 要約: 【課題】 光源・分光器・センサーの応答特性の違いから生ずる分光装置応答特性の違いを補正する分光装置応答特性の平準化法を提供する。【解決手段】 子機で測定した標準物質のスペクトルから親機で測定した同物質のスペクトルを差し引くことにより子機と親機の差を

BEST AVAILABLE COPY

[続案有]

From KNU-235-A - International Publication



LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,  
NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,  
SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,  
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

IB, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),  
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,  
MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護  
が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA,  
SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,  
BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE,  
BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,

2文字コード及び他の略語については、定期発行される  
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語  
のガイダンスノート」を参照。

BEST AVAILABLE COPY

クトルを求め、その差スペクトルを子機で測定する個々の測定対象試料のスペクトルから差し引くことにより、子  
機の応答特性を親機の応答特性に一致させる方法を提供する。 光源、分光器およびセンサーから構成される近赤  
外分光法を応用した装置において、子機の各波長における吸光度値の親機とのズレは測定する個々の試料で同様に  
発生するため、各波長における吸光度値のズレを個々の試料のスペクトルから差し引くことにより、分光装置応答  
特性の違いから発生するスペクトル歪みを補正することが可能となる。